

IPEN-DOC- 1833

DETERMINAÇÃO DE ESPESURA DE FILMES METÁLICOS POR
ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X,
POR DISPERSÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA

Vera Lucia Ribeiro SALVADOR e Wilson Santo SCAPIN Jr.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - SP
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
Caixa Postal - 11049 - Pinheiros
05499 - São Paulo - Brasil

RESUMO

Filmes finos metálicos podem ser obtidos por processos eletrolíticos ou de evaporação de metais. Os filmes, obtidos pelo processo de evaporação, são geralmente utilizados em equipamentos e aparatos ópticos como refletores.

Este trabalho apresenta um método absoluto para a determinação de espessura de filmes finos metálicos de Ni e de Al obtidos por processos de evaporação desses elementos em substrato de vidro.

Foram determinados matematicamente e empiricamente os coeficientes de absorção de massa para o Al e para o Ni, nos seus respectivos comprimentos de onda efetivo.

Foram determinadas espessuras compreendidas entre 500 a 5000 Å.

A Biblioteca tem em
microficha no resumo
INIS-BR-2077

1804
1802
PTC Jan